○X 線回折測定（結晶化分析）

測定条件

■機器名　　：Ｘ線回折装置 Ultima IV（株式会社リガク）

■分析方式　　：集中法

■試料調整　　：粉末法

■備考

・タイプ A については、非晶質に由来するハローが検出されたが、結晶性物質の存在を示すピークは確認できなかった（検出下限以下）。結晶ピークが確認できなかったため、結晶同定分析は実施せず。